

# 进行光子与光器件测试，应对制造、设计与研发挑战

更智能的  
网络  
指日可待

EXFO

## 公司简介

EXFO为全球通信行业开发更智能的测试、监测与分析解决方案。

### 我们如何在光子测试领域保持优势

我们认识到器件制造商需要一个能够在量产环境中进行端到端测试的整体解决方案。EXFO在光子集成电路（PIC）测试这一相对新的领域具有优势地位，所提供的硬件和软件解决方案具有自动化、可扩展、快速、精准和成本低的优点。这些创新的解决方案可以与任何第三方设备（如晶圆片处理系统）进行互操作。

我们开发出速度极快的PIC测试系统，使用“一个动态范围”类型的光探测器进行迅速、可重复的测量。

这款创新的解决方案将各种器件集成在一个芯片上，从而提高功能性和密度，同时降低生产成本和能耗要求。得益于光耦合方法方面的创新，我们可以在量产环境中进行晶圆级测试，最终大幅简化并加快测试。

EXFO的无源和有源光器件测试解决方案采用新颖的专利技术，在业内具有优势地位，能够提高测试效率，适用于多种封装形式的BAR、裸片、晶圆片或封装器件。该解决方案具备自动化的优点，可进行光学同步，从而提供非常精准、可靠的测量结果。

## 支持端到端的测试流程



### 一站式服务

提供专业技术和解决方案，优化研发和制造流程。



### 响应更快

提供全面的测试，降低成本并缩短上市周期。



### 无缝集成

可与您现有的流程无缝集成。



### 保护投资

通过面向未来的测试解决方案，自始至终提供高价值。



### 定制解决方案

通过行业合作，根据需求定制解决方案。



### 测试结果精准、可重复

通过自动化并提供出色的规格，支持量产要求。

## 创新的PIC测试解决方案

芯片实验室——光源 + 无源器件 + 有源测试	<b>光测试平台</b> 光源、可变光衰减器、光开关、光谱分析仪、功率计  LTB-12 OSICS 矩阵开关 MXS-9100	<b>可调谐扫频激光器</b> 新品  T200S T500S	<b>光谱分析仪</b>  OSA20 <b>可调谐滤波器</b>  XTA-50 XTM-50	<b>误码率分析仪</b>  BA-4000
	<b>无源光器件测试仪</b>  CTP10 CT440	<b>采样示波器</b>  EA-4000		
	<b>流量分析</b>	<b>时钟数据恢复仪</b>  CD-4000		

## 量身打造的解决方案，可满足您的需求

EXFO与其它具有创新精神的业者密切合作，提供定制化解决方案，成就了多家PIC制造商成功案例：

- EXFO与Hewlett Packard Enterprise (HPE) 公司及MPI Corporation公司合作，提供经过简化、能耗低、自动化且完全集成的晶圆级PIC测试解决方案，支持从研发实验室测试到量产的多种应用。HPE负责提供晶圆片；MPI负责解决晶圆处理和探针定位问题；而EXFO负责进行光学测试和测量。
- 发明PIC的AEPONYX公司也是领先的微光开关制造商，它需要一款解决方案来更快地测试硅光子器件。EXFO与AEPONYX及集成的光电探测系统开发商Maple Leaf Photonics (MLP) 合作，设计并定制了一个全自动的光电探测系统。该系统采用能够生成大量数据的超快光测试设备，用于鉴定器件的性能。与之前的技术相比，这款集成的解决方案将晶圆测试速度提高了10倍以上。
- Tower Semiconductor公司成功地优化了自己的PIC测试流程，所使用的系统将EXFO的CTP10无源光器件测试设备与MPI Corporation的TS3000晶圆片处理设备结合起来。这种组合满足了Tower Semiconductor公司对可扩展和可定制的代工厂测试系统的需求，可支持各个PIC器件的不同测试设置，并在整个PIC生态系统中为客户提供所需的精准且可溯源的测量结果。

关注EXFO微信公众号  
获取更多技术资讯



我们随时为您提供帮助。

联系EXFO销售代表，了解光子测试解决方案详情，  
或访问EXFO.com/zh

